

राष्ट्रीय संगोष्ठी (मापिकी - 2014)

मूल विषय: मापिकी एवं मापन मानकों का सामाजिक तथा औद्योगिक विकास में योगदान

सी.एस.आई.आर. - राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली

दिनांक	मंगलवार, 9 दिसम्बर, 2014		
09.30-11.10	तकनीकी सत्र 4:		
	सत्र अध्यक्ष: डॉ.ए. सेन गुप्ता, विशिष्ट वैज्ञानिक, सी.एस.आई.आर.-एन.पी.एल., नई दिल्ली		
	वक्ता		शीर्षक
09.30-09.50	आईटी-13	डॉ. अशोक कुमार मुख्य वैज्ञानिक (सेवानिवृत्त) सी.एस.आई.आर. - एन.पी.एल., नई दिल्ली	पराश्रव्य मापिकी में चुनौतियाँ और नवीनतम उपलब्धियाँ
09.50-10.10	आईटी-14	डॉ. हरि कृष्ण सिंह सी.एस.आई.आर. - एन.पी.एल., नई दिल्ली	क्वांटम हॉल आधारित प्रतिरोध मानक
10.10-10.30	आईटी-15	डॉ. रीना शर्मा सी.एस.आई.आर. - एन.पी.एल., नई दिल्ली	लम्बाई मापन: मापक एवम् चुनौतियाँ
10.30-10.50	आईटी-16	आशीष अग्रवाल, जयेंता एस. थांगजम एवं ए. सेन गुप्ता सी.एस.आई.आर. - एन.पी.एल., नई दिल्ली	रुबिडियम आवृत्ति मानक के लिए रुबिडियम अवशोषण सेल का विकास
10.50-11.10	आईटी-17	संध्या एम. पटेल, अनिश एम. भार्गव, पी.एस. नेगी एवं वी.एन. ओझा सी.एस.आई.आर. - एन.पी.एल., नई दिल्ली	विद्युतीय (AC) माप-पद्धति में जोसेफसन प्रभाव आधारित क्वांटम मानक पर परिपेक्ष्य
11.10-11.30	चाय		
11.30-01.10	तकनीकी सत्र 5:		
	सत्र अध्यक्ष: डॉ. वी.एन. ओझा, मुख्य वैज्ञानिक, सी.एस.आई.आर.-एन.पी.एल., नई दिल्ली		
	वक्ता		शीर्षक
11.30-11.50	आईटी-18	शंकर जी. अग्रवाल एवं प्रभात कुमार गुप्ता सी.एस.आई.आर. - एन.पी.एल., नई दिल्ली	रासायनिक माप में अनुमार्गण्यता : वैश्विक और राष्ट्रीय स्थिति, चुनौतियाँ और भविष्य की योजनाएँ

11.50-12.10	आईटी-19	ए. के. उपाध्याय, एम.वी.एस.एन. प्रसाद, सुमेधा गुप्ता, स्मृति तिवारी सिंह एवं रूबी मद्रावत सी.एस.आई.आर. - एन.पी.एल., नई दिल्ली	अत्याधुनिक डिजिसोण्ड सुविधा द्वारा दिल्ली के ऊपरी आयनमंडलीय क्षेत्र का वास्तविक समय में निरीक्षण
12.10-12.30	आईटी-20	रविदंर अग्रवाल एवं सुशील मित्तल थापर युनिवर्सिटी पटियाला	परिवेशी हवा में परटिकुलेटस मैटरस के सम्पर्क का बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रभाव
12.30-12.50	आईटी-21	डॉ. देवराज सिंह एमिटी अभियन्त्रिकी एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय, बिजवासन, नई दिल्ली	ताप मापन की उपयोगिता
12.50-01.10	आईटी-22	डॉ. कमलेश कुमार मौर्य सी.एस.आई.आर. - एन.पी.एल., नई दिल्ली	ग्रेजिंग इन्सिडेन्स इन प्लेन एक्स-रे परावर्तनमापी का तनु परतों के अभिलक्षणन में महत्व
0.1.10-02.00	मध्याह्न-भोजन		
02.00-04.00	तकनीकी सत्र 6:		
सत्र अध्यक्ष: प्रो. बी.पी. पटेल, आई.आई.टी., दिल्ली			
		वक्ता	शीर्षक
02.00-02.20	आईटी-23	डॉ. ए. के. बंद्योपाध्याय मुख्य वैज्ञानिक (सेवानिवृत्त) सी.एस.आई.आर. - एन.पी.एल., नई दिल्ली	अंतर (डीफरैन्शीयल) दाब मापन द्वारा ई-द्रव्यमान के निर्धारण की दिशा में एक नवीन दृष्टिकोण
02.20-02.40	आईटी-24	अनिल कुमार, गौतम मंडल एवं दिनेश चन्द्र शर्मा सी.एस.आई.आर. - एन.पी.एल., नई दिल्ली	बॉटों की मापिकी
02.40-03.00	आईटी-25	आशुतोष अग्रवाल लीगल मेट्रोलोजी विभाग, नई दिल्ली	विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009
03.00-03.20	आईटी-26	नीता दिलावर शर्मा, सुगंधा डोगरा एवं जसवीर सिंह सी.एस.आई.आर. - एन.पी.एल., नई दिल्ली	पदार्थ विज्ञान की मेट्रोलोजी के लिए रमन वर्णक्रमीयता (स्पेक्ट्रोस्कोपी)
03.20-03.40	आईटी-27	अशोक कुमार, परितोष सिंह हितेश बोरकर, बी. पी. सिंह एवं वी. एन. सिंह सी.एस.आई.आर. - एन.पी.एल., नई दिल्ली	ई-किरण विकिरणित नैनो माप

03.40-04.00	आईटी-28	पी.के. दुबे, युधिष्ठिर कुमार यादव एवं रीता गुप्ता सी.एस.आई.आर. - एन.पी.एल., नई दिल्ली	मेगाहट्टर्ज आवृत्ति में हाई पावर अल्ट्रासाउंड की मापन एवं समस्याएं
04.00-04.30	समापन समारोह अध्यक्ष: डॉ. ए. सेन गुप्ता, विशिष्ट वैज्ञानिक, सी.एस.आई.आर.-एन.पी.एल., नई दिल्ली		
04.30-05.00	चाय		